66068

分散型硬 X 線吸収分光法による触媒反応追跡

鈴木あ	ちかね	高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所	₹305-0801	茨城県つくば市大穂 1-1
丹羽	尉博	高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所	₹305-0801	茨城県つくば市大穂 1-1
稲田	康宏	高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所	₹305-0801	茨城県つくば市大穂 1-1
野村	昌治	高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所	₹305-0801	茨城県つくば市大穂 1-1

要旨 エネルギー分散型時間分解 XAFS(DXAFS)法の最大の特徴は、X 線をプローブとして触媒活性種の構造変化 を in-situ かつ実時間追跡し、反応機構を速度論的に解析できることである。一方で DXAFS 法のスペクトルの質は試料 の厚さや組成むらに非常に敏感である。触媒調製過程およびペレット調製法について工夫を重ねた結果、高担持量かつ高 分散の触媒を調製し、通常法でk=210 nm⁻¹まで良質なスペクトルを得ることが出来た。Ru₆/MgO 触媒への CO 吸着, Rh/Al₂O₃ 触媒への CO 吸着, Pt/MCM-41触媒への水素吸着/解離を実時間追跡した例を示す。

1. はじめに

固体触媒の触媒特性を担うのは,反応過程においてダイ ナミックな挙動を示す表面金属活性種である。この活性種 の挙動を直接観測する事が出来れば、どんなに面白いだろ うか? では、どのような測定が有効だろうか? この問 いの答えの1つとして、エネルギー分散型時間分解 XAFS (DXAFS) 法がある。この手法の最大の特徴は, X線をプローブとして活性種の構造変化を in-situ かつ実 時間追跡し、反応機構を速度論的に解析できることであ る。固体触媒の機能は反応活性金属種の配位子交換、結合 の伸縮/切断,電子移動等により発現するものであり,高 活性触媒の開発にはこれらの現象を理解することが重要で ある。NMR,時間分解 IR 等は汎用的に使われるが間接 的な情報しか得られず、活性種自身の構造変化を直接的に は解析出来ない。また XRD は試料として結晶を要求され ある程度以上の濃度を必要とするので担持触媒には不向き な場合が多い。これらに対し、X線吸収微細構造(XAFS) 法は特定原子近傍の構造を解析する手段であり、周期構造 を持たない試料に対して適用可能なことに加え、測定条件 に対する制約が少ない優れた手法である。XAFS 信号を Fourier 変換して得られる動径構造関数からは対象原子か らの距離を指標とした部位選択的な情報が得られる。触媒 化学ではこの特徴を生かした多くの報告例があり、有用性 は広く認識されている。更に XAFS 法に時間分解能を付 与した DXAFS 法の開発により、反応途中に出現する反 応中間体および不安定な短寿命化学種の in-situ かつ実時 間観察およびその時間変化から反応速度を決定することが 可能となり,触媒反応の分子・原子レベルでの反応機構に 光が当てられつつある。我々は1998年から DXAFS 実験

を開始し¹⁻⁹⁾,短寿命の触媒活性中間種を捕捉することに 成功している。本稿では実験法,試料調製法のノウハウを 紹介するとともに,DXAFS法を用いた研究例をいくつか 紹介する。

2. DXAFS 法とは

X線を吸収する原子の周囲の局所構造情報を直接的に 与える XAFS 法は, 触媒の構造解析に今や不可欠の手法 となりつつある。しかし通常の XAFS 法は一スペクトル の測定に十数分を要するため、反応前後の安定構造は測定 できるが、動的な構造変化の追跡は困難である。これに対 し、触媒研究に適用可能な2つの時間分解XAFS実験法 がある。これらは Quick XAFS (QXAFS) 法¹⁰と Dispersive XAFS (DXAFS) 法¹¹⁾である。通常の XAFS 実験で は各データ点ごとに分光結晶の角度を変えてデータを蓄積 し、また角度を変えることを繰り返すが、QXAFS では分 光器を連続掃引しながら測定する (on the fly)。一方 DXAFS 法では湾曲した分光結晶を用いて目的とするエネ ルギー領域全域を同時に測定する。QXAFS は既存 XAFS 用ビームラインのわずかな改造で対応可能であること、透 過法以外の検出法にも適用可能であること, XRD など他 の解析法との複合化も可能であること等の利点があるが、 入射X線のエネルギーを掃引するため、一つのスペクト ルの始点と終点とで異なる時刻での状態を観測しているこ とに注意が必要である。一方 DXAFS 法は,透過法に限 定される等の制約はあるが、測定中に機械的な動きが全く なく安定であること,現状で十分なX線強度があり,単 発現象を追跡できる時間分解能を持ちうる点で優れてい 3.



Fig. 1 Schematic diagram (a) and photograph (b) of DXAFS set up at NW2A. The curved crystal is installed in the chamber filled with helium. The glancing angle of X-ray beam varies continuously across the crystal surface and results in different X-ray energies being reflected from different points on the crystal surface.

Fig. 1に DXAFS 法の構成図を示す。湾曲結晶に白色 X 線が当たった時に,X線が当たる位置により入射角が異 なるため,水平面内にエネルギーが分散する。水平面内に 分散している X線強度をフォトダイオードアレイ (PDA) やX線用 CCD 検出器,マイクロストリップ検出器等の一 次元検出器を用いて位置敏感測定する。試料の厚さや組成 むらによるスペクトルの歪みを防ぐために,試料は集光部 に配置し,その均質な場所にX線を通す必要がある。触 媒反応の研究では,試料の加熱処理やガス導入,レーザー の照射などにより反応を開始させることが多い。そのよう な加熱やガス導入に要する時間は反応と比して十分短くな ければならない。また測定したい時間スケールに対して計 測系が十分な時間分解能を有している必要がある。

DXAFS 法は1981年に松下ら¹¹⁾が放射光をX線光源として,砂オーダーの時間で金属箔のXAFS 測定に成功した後,1982年にはフランスのA. Fontaine らも同様の手法で金属箔や無機酸化物の測定を報告した。その後,DXAFS 法は世界各地の放射光施設において使われてきたがそれほど注目されなかった。なぜなら,実験用X線光

学系や位置敏感検出器の利用等の特殊性,エネルギー分解 能の制約や,通常の透過法測定による in situ 観察がやっ と開始された段階であったなど,DXAFS 測定の必要性が 叫ばれる環境になかったからである。また,1988年に R. Frahm らが秒程度での測定が可能で汎用性の高い QXAFS 法を開発したこと,同じ時間分解能で比較すると QXAFS のエネルギー分解能がDXAFS より優れていたこ とも理由であろう。ところが近年になって,気相や吸着分 子の速度論だけではなく,触媒自身の速度論的解析の要請 が高まるにつれ,高い時間分解能で活性構造の変化を追跡 できる手法としてDXAFS 法に注目が集まってきた。

3. 試料調製

XAFS スペクトルの質を決定する重要因子は,(1) X 線 の強度と純度,(2)試料の均質性である。(1)に関して実験者 が工夫出来ることは限られているが,(2)については工夫の 余地が大きい。溶液や金属薄膜の場合は,均一で適切な厚 さの試料を調製することが比較的容易である。しかし,固 定化触媒等の粉末試料の場合,触媒調製過程,ペレット調製法に大きく依存する。DXAFS法の場合,異なるエネルギーのX線は異なる光路をとるため,通常法と比較して,試料の厚さや組成むらがスペクトルの歪みに与える影響が大きくなる。このため解析可能な波数kの範囲は従来k=100 nm⁻¹程度であった。しかしPt-Ptのクラスター 骨格領域をカバーするためには,k=140 nm⁻¹までのデータが必要であり,本研究では(1)試料調製,(2)ペレット 作成方法について改善した。以下に,詳細に述べる。

(1)固定化触媒は、部分的に金属化しないよう、分散度を 上げる必要がある。例えば、触媒調製過程には、焼成プロ セスがあり、通常、内径6mmから20mmのガラス管の 中に触媒粉末およびその上下にガラスウールを詰め、ガス フローしながら昇温を行う。しかし, 試料の場所により, 温度とガスの流量に不均一性が生じ、これが化学組成の不 均一性の一因となる。そこで、粉を定位置ではなく、常に 舞った状態にすることで調製条件の均一化を図った。ま た、通常は調製開始段階における担体および調製後に、試 料粉末を乳鉢で細かくすり潰してペレットを調製するが、 これでは不十分である。顕微鏡下での目視観測で組成の異 なる部分は取り除いた後に乳鉢で細かくすり潰すという作 業を試料調製の各段階で入念に行うことが均一な試料を調 製するポイントである。3.5 wt% Pt/MCM-41触媒では, イオン交換法により Pt 金属微粒子を担持し調製した。水 素吸着量測定により分散度を測定し、Pt 一原子あたり化 学吸着した水素は0.9であり、0.5 wt%の低担持量の場合 と同等の吸着量が得られ、高分散した触媒を合成できたこ とが確認出来た。(2)続いて粉末試料をペレット成型する。 この際、一般的には油圧プレス機を使用するが、試料を均 一に調製することは意外に難しい。また、試料の厚みが適 正値から外れるとペレット成形自体が困難である。そこで、 Fig. 2 に示すようなペレット作成器具を作成した。外形10 mm, 内径7mmのSUS310製の筒(c)をベースプレート (b)の爪に引っかけ、上蓋(a)を閉め、ピン(e)で固定す る。最後にサンプルを上蓋にあるテーパーを利用して筒 (c)に詰め、上部から7mmの棒(f)を用いて手で押すとリ ングの中にサンプルが詰まったペレットが完成する。この 時、試料厚さが均一になるように針で粉末の厚さ調整を行 う。試料(d)は筒(c)から外すことなく XAFS 測定に用い る。本器具の特徴は、①均一なペレットを容易に作製可能, ②厚さに関係なく油圧プレスを用いずに低圧で作製可能, ③筒からペレットを外さないため、壊れ易い薄い試料でも 容易に扱えることであり、これにより、昇温過程での温度 ムラが生じにくく, in-situ 測定においても, 数十 msec と いう時間スケールでもガスのペレット内部拡散に影響が無 い試料の作製が可能になった。

Fig. 3にこの方法を用いて調製した試料の XAFS 信号を 示す。試料調製を注意深く行うことによりスペクトル(a) を得た。通常法では $k = 210 \text{ nm}^{-1}$ まで,また DXAFS 法





Fig. 2 Schematic diagram of the hand press for powder samples. (a): outer jacket, (b): base plate with a knurl, (c): sample holder tube, (d): sample, (e): fixing pins, (f): plunger whose end surface is anvil finished.



Fig. 3 k³-weighted EXAFS signal measured by the conventional XAFS (-) [21 min] and DXAFS (-) [60 ms] for Pt/ MCM-41 cluster. a): Well prepared uniform sample, b): Non-uniform sample.

でも $k=140 \text{ nm}^{-1}$ まで解析可能である。また,これらの スペクトルの測定時間は,通常法では21 min であり, DXAFS 法の場合は60 ms と21000倍も高速の測定が可能 である。一方,注意深く調製した(a)と同じロットから採 取した試料でも、ペレット調製の仕方によってはスペクト ル(b)になってしまう。通常法では $k=170 \text{ nm}^{-1}$ まで解析 可能であるが,DXAFS 法では $k=100 \text{ nm}^{-1}$ までしか解 析出来ない。このように、ペレット調製は XAFS スペク トルの質に大きな影響を与え、特に DXAFS スペクトル はペレット調製の影響を受けやすい。試料調製に不備があ ると、データ積算時間を増やしてもスペクトルの質を改善 出来ないので、細心の注意が求められる。

4. DXAFS 法から得られた触媒化学現象

触媒は触媒作用中ダイナミックな構造変化を起こし、それが触媒特性を決めていることが多いが活性種については 驚くほど不明な事が多い。配位不飽和な金属クラスターの 反応性を利用するにはその金属骨格構造を保つことが重要 であるが担持クラスターは触媒反応条件下で分解あるいは 凝集し、元のクラスター構造を失うことが多い。そこで触 媒表面上で活性点構造の変化が規定されて起こるものの例 として Ru₆/MgO、分解する例として Rh/Al₂O₃をターゲ ットとし、酸化物表面に存在する触媒活性種の吸着、脱 離、骨格の伸縮など化学結合の挙動、順序などクラスター 骨格構造変化を DXAFS 法用い明らかにした。

4.1 Ru₆/MgO 触媒の CO 吸着過程

Ru₆C クラスターを担持した MgO は、CO/H₂ ガスを導入するとCO を非解離型でアルデヒドへ選択的に還元する (CO + H₂→CH₂O) 優れた触媒^{12–13)}である。しかしなが ら、反応中におけるCO分子のRu₆C骨格への結合状態、 およびRu₆C骨格の構造変化の詳細については解析されて いなかった。本研究では、CO存在/非存在下における Ru₆C クラスターの活性構造変化を時間分解測定した。

Fig. 4に示されるように、423 K におけるカルボニル化 過程では CO が飽和吸着量の半分配位した後(0-4.2 s) に Ru-Ru 骨格が伸張し(R = 0.265 nm-> 0.269 nm) (10.5 s)、その後配位 CO の増加と共に Ru-Ru が終状態 へと移行した(R = 0.269 nm-> 0.271 nm)(31.5 s)。即 ち担体と結合していない Ru 一原子に対して2分子の CO が結合した後,遅れて Ru₆ 骨格の変化が生じている。

一方, Fig. 5 に示されるように573 K における脱カルボニル化過程では、まず CO が飽和状態の半分脱離する間にRu-Ru 距離が0.271 nm から0.269 nm に僅かに縮み(0-4 min),その後 CO が完全に脱離(11 min)してから Ru-Ru 距離が0.269 nm から0.265 nm に減少する(15 min)ことが分かった。さらにこれらの構造変化を異なる温度で測定し、Ru-CO の配位数及び Ru-Ru の距離の変化より



Fig. 4 Variation of coordination numbers (CNs) of Ru–CO (a) and interatomic distances (R) of Ru–Ru (b) during CO/H_2 reaction at 523 (\bullet), 473 (\Box), and 423 (\blacktriangle) K.



Fig. 5 Variation of CNs of Ru-CO (●) and R of Ru-Ru (□) during decarbonylation under vacuum at 573 K after CO/H₂ reaction.

活性化エネルギーを求めることに成功した。結果を Fig. 6 に示す。

このように EXAFS の時間変化から, MgO 担持 Ru₆C クラスターのカルボニル化及び脱カルボニル過程は各々3 段階の複合過程であり,カルボニル化過程と脱カルボニル 過程では,Ru-Ru の結合長変化に関してヒステリシスが 存在することが分かった。これは,対象元素からの距離を 指標とした動態分析によって初めて明らかになった知見で ある。本結果から,本触媒を用いたホルムアルデヒド合成 過程について以下の触媒反応機構を推定した:CO が Ru₆ C 骨格に吸着することで,骨格が膨張し,骨格間サイトに H_2 が侵入して Ru 上の CO と反応しアルデヒドを生成す る。アルデヒドの生成によって Ru 上の CO が脱離される



Fig. 6 The energy profiles for the structural changes in the steps determined by DXAFS.

ことにより骨格が再収縮する。継続的に供給される CO に よって、このように膨張・収縮が繰り返される。Fig. 6 中 の活性化エネルギーに示されるように膨張速度は収縮速度 に比べて一桁速く、かつより低温でも反応が起こることか ら、膨張した構造が活性であることが明らかとなった。

4.2 Rh/Al₂O₃ 触媒の CO 吸着過程

Rh は自動車の排ガスに含まれる有害物質を取り除く触 媒として使用されるため数多くの研究がなされている。特 に Al₂O₃ 表面に担持された Rh クラスターは, CO 吸着に より Rh-Rh 結合が切れて Rh モノマー種に転換される特 殊な性質を持つため多くの注目を集めてきた。この反応前 後の構造は XAFS により明らかにされているが¹⁴⁾, Rh ク ラスターが CO 吸着に伴いどのような過程を経て高分散状 態に変化するか,その時間スケールおよび Al₂O₃ 表面の役 割などについての詳細は明らかではなかった。そこで Rh /Al₂O₃ 触媒における CO の吸着と Rh の表面分散過程の関 係を明らかにするために, CO 吸着過程を数百ミリ秒の時 間分解能で追跡し,その反応機構を原子レベルで解明し た⁶⁾。

2 wt%の Rh/y-Al₂O₃ 触媒は773 K で前処理した y-Al₂O₃ に RhCl₃·3H₂O の水溶液を加え含侵法により調製した。得られた試料を3節に記した方法でディスク状に成型し,試料セル中で水素流通下(120 cm³min⁻¹)613 K まで昇温(4 K min⁻¹)し,更に同温度で1.5時間水素処理した後,573 K で1時間排気した。

CO 導入前 (t=0 s) は Rh-Rh (N=5.0, R=0.265 nm) と Rh-O (N=1.6, R=0.213 nm)の存在が確認され,通 常の XAFS 実験結果と一致した。Rh fcc (111)面の層状構 造を仮定すると,Rh 周りのOと Rhの配位数から,1層 目に7原子と2層目に3原子のRhで構成されるクラス ターが Al₂O₃ 表面上に形成していることが分かる。Rh/γ-Al₂O₃ 触媒の CO 吸着過程における XAFS 信号のフーリエ



Fig. 7 The k³-weighted EXAFS Fourier transformed functions for Rh/Al₂O₃ at the Rh K-edge during the carbonylation process at 298 K measured by DXAFS.





変換の絶対値(動径構造関数)の時間変化を Fig. 7 に示す。 この図から明らかなようにガス導入直後に Rh-CO のピー ク強度が増大しているのに対し, Rh-Rh は遅れてピーク が減少し、僅か数秒で消失していることがわかる。構造パ ラメーターを解析したところ, Fig.8に示すようにこの反 応は三段階で進行することが明らかになった。まず Rh ク ラスター(始状態A)にCOが部分的に配位し(中間体 B, $[Rh_{10}(CO)_3]$, N(Rh-CO) = 0.7) (0.6 s), 続いて CO/ Rh=1 まで CO が吸着すると共に Rh-Rh 結合が切断され る (中間体 C, [Rh-CO]₁₀, N(Rh-Rh)=0, N(Rh-CO)= 1.2, N(Rh-O) = 2.5, R(Rh-O) = 0.213 nm) (3 s)。その後 COが飽和吸着し、Rhは Al_2O_3 表面の酸素原子とより強 く結合しながらモノマー種として分散される(終状態D, $[Rh(CO)_2], N(Rh-CO) = 1.9, N(Rh-O) = 3.2, R(Rh-O) =$ 0.200 nm)(6 s)。また三段階目の反応速度のみが活性化 エネルギー17 kJ mol⁻¹で温度に依存することと Rh-Oの 距離や吸収端近傍のスペクトル変化から、この過程で Rh は0価から1価に酸化されると結論づけた。

この CO 吸着挙動は FT-IR や吸着量測定により支持された。CO 存在下では Rh/Al₂O₃から [Rh(CO)₂] (ν_{co} : 2023, 2095 cm⁻¹) になる前に, Rh に 1 分子の CO が配位した状態 (ν_{co} : 2060 cm⁻¹) を経る (1.5 s) ことが IR 測定より示唆された。また, 圧力測定より求めた CO 吸着量の挙動は DXAFS で決定した配位数の変化と一致し,

DXAFS 解析の高い精度が確かめられた。このように触媒 活性種について DXAFS を用いて短寿命な中間種の存在 とその構造に関する情報を得ることができる。

4.3 Pt/MCM-41触媒の水素吸着/脱離過程

SiO₂などの担体に担持された Pt ナノクラスターは水素 化反応等に対して高い活性を持つ優れた触媒である。この ような反応では水素解離吸着機構の理解が重要であるが, 吸着した水素の定量的解析手法は昇温脱離法に限られ、気 相共存条件下で測定する事は困難である上、活性種の構造 に関する情報は得られない。一方, Pt ナノクラスターの XAFS は触媒分野での重要性から多くの研究がなされて きた。その結果,水素を導入すると水素吸着により White line のピーク強度が低下するとともに高エネルギー側に ピークが広がり¹⁵⁻¹⁶⁾,またPtナノクラスターの水素吸着 に伴い Pt-Pt 結合が0.003-0.02 nm 伸張することが報告さ れている¹⁷⁻¹⁸⁾。この反応は水素の吸着,解離,Ptナノク ラスター構造の変化等,複数の素過程を含み,多段階で進 行すると考えられるが、反応途中のPtナノクラスターの 構造・電子状態に関する報告はない。こうした一連の過程 を逐次的に追跡することが吸着ダイナミクスの解明に必要 であると考えられる。そこで我々は3節に記した方法で, 3.5 wt%と高担持量でありながら高分散状態を保っている Pt/MCM-41触媒を調製し、通常の XAFS および DXAFS スペクトルを測定した(Fig. 3)。また DXAFS を用いて 3.5 wt% Pt/MCM-41触媒の水素吸着/脱離に伴う構造変 化プロセスを60 msの時間分解で逐次追跡した。Fig.9に は還元過程における XANES の変化を示す。A で示され る White line の強度は白金のd 電子密度を反映し, B で 示される White line 直後の谷の部分の変化は Pt に H が吸 着していることを反映している。水素導入過程ではガス導 入直後,1sまでにA,B共に6割反応が進行し,その後 200 sかけてゆっくり反応が進行する。この過程において はA,Bが逆方向に同様な挙動を示すことが分かった。一 方酸素導入過程では,酸素導入直後,Bが急激に減少し, 1.8 s までに 6 割変化 するが A は 1.5 割ほどしか変化しな い,その後,4sまでにAは5割変化し120sかけてゆっ くりと終状態へと変化する。即ち酸素導入過程では水素の 脱離がドライビングフォースであり Pt は酸素と結合する 事が分かった。また水素-酸素の表面反応に伴う水素吸 着,骨格変動(0.273 nm <->0.254 nm)に関するダイナ ミクスを明らかにした。

5. ナノ秒時分割 XAFS へ向けて: XSTRIP を用いた DXAFS 法の高速化

光触媒反応において,UV-VIS光の照射により生成す る光励起金属化学種が重要な触媒作用を持つ。光励起によ り生成する配位不飽和低原子価金属化学種は,その金属中



Fig. 9 A series of XANES spectra at Pt L_{III} -edge in the reduction process of Pt/MCM-41.



Fig. 10 Illustrative image of single bunch at PF-AR and XAFS spectra of Cu foil measured in 130 ps (red) with XSTRIP detector combined with DXAFS system and usual XAFS (black).

心近傍に反応相手となる物質を選択的に取り込み,高効率 で還元する反応場である。従って,高効率な実触媒の開発 にとって,基本的な金属化合物の光励起状態,中間種等を 原子レベルで解明することは重要である。従来の電子,振 動スペクトルをプローブとする測定法では活性化学種の構 造の直接決定は困難である。一方,DXAFSからは金属中 心からの距離を指標とする部位選択的構造情報が得られ る。しかし活性種の寿命は多くの場合μsオーダー以下で あり,測定は容易でない。

PF-AR は常時シングルバンチモードで運転を行ってお り、約100 ps 幅のパルス X 線が1.26 µs 間隔で得られる。 中エミッタンスリングである PF-AR に設置された真空封 入型テーパードアンジュレーターは1keV程度のエネル ギー広がりに対して滑らかな強度分布を持った EXAFS 実験に適したX線を発生する。NW2Aでは1パルスで XANES 測定が可能な大強度 X線が期待される。通常の pump-probe 実験では反応の再現性が不可欠であるが、電 子がリングを一周する間に信号処理を出来る検出系があれ ば、1.26 µs 毎に100 ps の時間分解能で単発現象を追跡す ることが可能となる。現在 Daresbury lab. で開発された ピクセルアレイ検出器 (XSTRIP)¹⁹⁾を利用した装置の立 ち上げおよび評価実験を行っている。XSTRIP はデータ 処理速度の制約から測定時間間隔22 µs 以上に制限され, S/N 比は通常の XAFS スペクトルと比べるまでもないが, 100 ps 幅の単パルスで XANES スペクトルを得ることが 出来た(Fig. 10)。今後,検出素子の改良による検出感度 の改善、信号処理回路の高速化による信号読み出し間隔の 短縮も期待される。

6. おわりに

XAFS は X 線吸収原子の周囲の電子状態,配位数や原 子間距離等の構造情報を直接的に与えることが出来る強力 な手法である。しかしながら反応速度解析において, XAFS が万能とは限らず,紫外可視,赤外分光等の方が 優れている場合もある。従って,研究対象が XAFS のメ リットを十分に享受出来る系であるかどうか検討が重要で ある。XAFS の特徴は原子選択性にあるが,一方で部分 的な化学状態の変化に関しては鈍感な面がある。触媒反応 の場合これは長所とも短所ともなりうる。X 線吸収スペ クトルの吸収の大部分は原子吸収に起因しており,構造を 反映する XAFS 部分は,10%以下であり,比較的鈍感で あることは注意を要する。また,DXAFS に限らず XAFS 全般に共通するが,測定対象の濃度が重要である。更に反 応中間体を測定するのなら,十分な濃度で中間体が生成す る反応系に条件を設定する事が重要である。

最後に,DXAFS法の利用状況について述べたい。 DXAFS を利用するグループは世界的にみても限られてい る。各種の検出法が使え,汎用性という面ではQXAFS や通常のXAFS 法の方が適当である。だが,たとえ多く の困難があろうとも短時間で起こる単発現象の挙動を理解 しようとする場合,DXAFS 法は非常に魅力的な手段であ ることには変わりない。

普及していない理由の1つは、セットアップの難度が 高い事である。これは装置の改良や調整法の確立により、 しきいは低くなりつつある。次に、DXAFSの測定機構や 性能が十分に理解されていない事がある。XAFSを使用 していないグループにもDXAFSの長所を生かせる案件 を多く見受ける。我々としては、装置性能の向上、より簡 便なセットアップの確率により DXAFS 測定の汎用性を 高める事、更に、測定例を公開・報告し、DXAFS の認知 度を異なる分野までも高める事であると考えている。更に 今後、この DXAFS を究極の手法として発展させるに当 たり、装置開発グループと反応のグループが協力し合って 開発を進めることが重要である。

DXAFS 装置の開発および利用研究は岩澤康裕教授,朝 倉清高教授,紫藤貴文助教授,山口有朋博士と共同で行っ てきたものである。Ptの測定においては小池祐一郎博士 と共同で行ってきたものである。XSTRIP は,Daresbury lab. で開発され,David Bogg,Jon Headspith,Giuseppe Salvini, Richard Farrow らの協力を得て立ち上げを行った。

参考文献

- A. Yamaguchi, T. Shido, Y. Inada, T. Kogure, K. Asakura, M. Nomura and Y. Iwasawa: *Catal. Lett.* 68, 139 (2000).
- A. Yamaguchi, A. Suzuki, T. Shido, Y. Inada, K. Asakura, M. Nomura and Y. Iwasawa: *Catal. Lett.* **71**, 203 (2001).
- A. Yamaguchi, T. Shido, Y. Inada, T. Kogure, K. Asakura, M. Nomura and Y. Iwasawa: *Bull. Chem. Soc. Jpn.* 74, 801 (2001).
- A. Yamaguchi, A. Suzuki, T. Shido, Y. Inada, K. Asakura, M. Nomura and Y. Iwasawa: J. Phys. Chem. B 106, 2415 (2002).
- 5) Y. Iwasawa: J. Catal. 216, 165 (2003).
- A. Suzuki, Y. Inada, A. Yamaguchi, T. Chihara, M. Yuasa, M. Nomura and Y. Iwasawa: *Angew. Chem. Int. Ed.* 42, 4795 (2003).
- A. Suzuki, A. Yamaguchi, T. Chihara, Y. Inada, M. Yuasa, M. Abe, M. Nomura and Y. Iwasawa, *J Phys. Chem. B* 108, 5609 (2004).
- Y. Iwasawa, A. Suzuki and M. Nomura: *Phys. Scripta* **T115**, 59 (2005).
- A. Suzuki, Y. Inada and M. Nomura: *Catal. Today* 111, 343 (2006).
- 10) R. Frahm: Nucl. Instrum. Methods A270, 578 (1988).
- 11) T. Matsushita and R. P. Phizackerley: *Jpn. J. Appl. Phys.* 20, 2223 (1981).
- 12) Y. Izumi, T. Chihara, H. Yamazaki and Y. Iwasawa: J. Phys. Chem. 98, 594 (1994).
- T. Chihara, K. Aoki and H. Yamazaki: J. Organomet. Chem.
 383, 367 (1990).
- 14) H. D. J. van't Blik, J. B. A. D. van Zon, T. Huizrunga, J. C. Koningsberger and R. Prins: J. Am. Chem. Soc. 107, 3140 (1985).
- 15) K. Asakura, T. Kubota, N. Ichikuni and Y. Iwasawa: Proc. 11th Int. Congres on Catalysis, Baltimore, Stud. Surf. Sci. Catal. 101, 911 (1996).
- 16) T. Kubota, K. Asakura, N. Ichikuni and Y. Iwasawa: *Chem. Phys. Lett.* **256**, 445 (1996).
- 17) D. C. Koningsberger, J. de Graaf, B. L. Moret, D. E. Ramaker and J. T. Miller: *Applied Catalysis A* **191**, 205 (2000).
- 18) S. J. Cho, W. S. Ahn, S. B. Hong and R. Ryoo: *J. Phys. Chem.* 100, 4996 (1996).
- 19) J. Headspith, G. Salvini, S. L. Thomas, G. Derbyshire, A. Dent, T. Rayment, J. Evans, R. Farrow, C. Anderson, J. Cliche and B. R. Dobson: *Nucl. Instrum. Methods* A512, 239 (2003).



鈴木あかね 高エネルギー加速器研究機構 物質構造 科学研究所。日本学術振興会特別研究員

E-mail: akane@post.kek.jp 專門: 触媒化学 [略歷] 東京大学大学院理学系研究科化学専攻博

土課程修了,博士(理学),2004年4月 から現職。触媒を用いた時間分解 XAFS法に従事している。

丹羽尉博

高エネルギー加速器研究機構 物質構造 科学研究所産学連携研究員 E-mail: yasuhiro.niwa@kek.jp 専門:溶液化学,錯体化学 [略歴]

2005年立命館大学大学院理工学研究科 博士後期課程満期退学。理学修士。 2005年10月より現職。



● 著 者 紹 介 ●

稲田康宏

高エネルギー加速器研究機構物質構造科 学研究所助教授 E-mail: yasuhiro.inada@kek.jp 専門:無機反応化学

[略歴]

1992年名古屋大学大学院理学研究科博 土課程(前期課程)修了,博士(理学), 1992年名古屋大学理学部化学科助手, 1998年名古屋大学物質科学国際研究セ ンター助手,2004年より現職。

野村昌治

高エネルギー加速器研究機構物質構造科 学研究所教授

E-mail: masaharu.nomura@kek.jp 専門:XAFS 実験法開発

[略歴]

1982年東京大学大学院理学系研究科化 学専攻博士課程修了,理学博士,高エネ ルギー物理学研究所放射光実験施設助 手,助教授,高エネルギー加速器研究機 構物質構造科学研究所助教授を経て, 1999年より現職。

Real time studies of catalytic reactions by DXAFS

Akane SUZUKI Yasuhiro NIWA Yasuhiro INADA Masaharu NOMURA Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization Oho, Tsukuba 305–0801, Japan Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization Oho, Tsukuba 305–0801, Japan Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization Oho, Tsukuba 305–0801, Japan Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization Oho, Tsukuba 305–0801, Japan

Abstract DXAFS is a powerful technique for elucidating dynamic structure changes at active metal sites on catalyst surfaces. It opens a new area of structure kinetics, revealing kinetic parameters during catalytic reactions, catalyst preparations, and catalyst deactivation and regeneration. However, DXAFS is sensitive to sample homogeneity. Thus the sample and pellet preparation methods were improved. In so doing, highly dispersed catalysts were prepared at high loading and XAFS signal was obtained up to $k = 210 \text{ nm}^{-1}$. Here, example of such catalytic reactions observed with DXAFS are introduced; CO adsorption on Ru₆/MgO, CO adsorption on Rh/Al₂O₃ and hydration and dehydration of Pt/MCM-41.